

最先端計測共用ネットワークにおける 利用者ニーズのパラダイムシフト

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム微細構造解析プラットフォームシンポジウム

日時: 2019年6月17日(月) 9:00~13:45

場所: 名古屋国際会議場G会場(1号館4Fレセプションホール西)

<プログラム>

- 09:00-09:15 「ガラスにおける相分離構造の高温その場観察」
中澤 克昭¹、安間 伸一²、溝口 照康¹ (¹ 東京大学、² AGC 株式会社)
- 09:15-09:30 「EELS による物質の誘電関数測定に向けた検討」
坂口 紀史、國貞 雄治 (北海道大学)
- 09:30-09:45 「歯科材料応用を旨とした自己酸化被膜 Ti 合金の界面構造観察」
三浦 永理、原田 宏貴、内田 恭兵 (兵庫県立大学)
- 09:45-10:00 「放射光その場 X 線回折を用いた IoT 関連半導体材料の構造解析」
佐々木 拓生、高橋 正光 (量子科学技術研究開発機構)
- 10:00-10:15 「AlGaIn/GaN HEMT のイオン照射効果の観察」
佐々木 肇¹、日坂 隆行¹、門岩 薫¹、石村 栄太郎¹、小野田 忍²、大島 武²、
田口 栄次³、保田 英洋³、森 博太郎³
(¹ 三菱電機株式会社、² 量子科学技術研究開発機構、³ 大阪大学)
- 10:15-10:30 休憩
- 10:30-10:45 「超伝導蛍光 X 線検出器付走査型電子顕微鏡 (SC-SEM) による SEM-EDX の
新しいパラダイム」
浮辺 雅宏¹ (¹ 産業技術総合研究所)
- 10:45-11:00 「透過型電子顕微鏡による液晶性を示す棒状ナノ粒子の構造解析」
梶山 智司¹、中山 真成¹、熊本 明仁¹、西村 達也¹、幾原 雄一¹、山登 正文²、
加藤 隆史¹ (¹ 東京大学、² 首都大学東京)
- 11:00-11:15 「次世代半導体用の配線接合材料の構造解析」
関根 重信¹、荒井 重勇²、中尾 知代²、榎本 早希子²、中野 美恵子²、山本 剛久²
(¹ 有限会社ナプラ、² 名古屋大学)
- 11:15-11:30 「緑色光合成細菌の光捕集アンテナ系を模倣したクロロフィル集積体のナノ構造」
庄司 淳、民秋 均 (立命館大学)
- 11:30-13:00 休憩
- 13:00-13:15 「軟 X 線光電子顕微鏡による微粒子のナノスケール化学状態分析」
吉越 章隆 (日本原子力研究開発機構)
- 13:15-13:30 「シャペロン複合体を利用した金属ナノ粒子の平面上への並置」
依田 ひろみ、小池 あゆみ (神奈川工科大学)
- 13:30-13:45 「新たな触媒機能開発を目指した先端電子顕微鏡状態解析」
松村 晶、鳥山 誉亮、山本 知一 (九州大学)

※参加には日本顕微鏡学会第75回学術講演会への参加登録(参加費あり)が必要です。

詳しくはこちらから→<http://jsm75-2019.com/>

問合せ先: 微細構造解析プラットフォーム推進室

電子メールアドレス: acnp@nims.go.jp